

PRESSEINFORMATION

Ansprechpartner für Redakteure: Rahman Jamal, Technical & Marketing Director Europe
Silke Loos, Team Leader Communications & Media Relations
Tel.: +49 89 7413130
Fax: +49 89 7146035

„Vom Sensor zum Prüfbericht“ – kostenfreies Praxisseminar von National Instruments

Pressemitteilung im Januar 2012 – National Instruments veranstaltet ab dem 31. Januar 2012 das Praxisseminar „Vom Sensor zum Prüfbericht“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In dem kostenfreien Seminar wird gezeigt, wie Anwender mithilfe von Hard- und Softwareprodukten von NI Mess- und Prüfsysteme erstellen können, die sich durch eine hohe Flexibilität und Anpassbarkeit auszeichnen.

Das Praxisseminar stellt dar, wie Benutzer auf Basis der modularen und softwaredefinierten PXI-Plattform Prüfsysteme mit höherem Durchsatz und verbesserter Flexibilität zu geringen Gesamtkosten erstellen können. Des Weiteren werden die Softwareprodukte NI DIAdem und NI TestStand vorgestellt, die es ermöglichen, Messdaten strukturiert auszuwerten und zu verwalten sowie intuitive Testabläufe und Prüfberichte zu erstellen.

Außerdem wird die grafische Entwicklungsumgebung NI LabVIEW näher beleuchtet. Mit ihr lassen sich beliebige Messgeräte über unterschiedliche Schnittstellen an einen PC anbinden. Die Teilnehmer erfahren mehr über softwarebasierte computergestützte Messtechnik und die so genannten Virtuellen Instrumente. Durch sie lassen sich unter anderem flexible softwarebasierte Funktionalität, ein hoher Datendurchsatz und eine unkomplizierte Hardwareanbindung realisieren.

Den Seminarteilnehmern wird zudem vermittelt, weshalb sich LabVIEW optimal als Plattform für alle Anwendungen eignet – von der Gerätesteuerung, Datenerfassung und Digitalsignalverarbeitung über die Analyse und Benutzeroberflächenerstellung bis hin zur Implementierung von verteilten und echtzeitbasierten Mess- und Automatisierungssystemen.

Themenschwerpunkte des Praxisseminars:

- Gerätesteuerung und Datenerfassung mit beliebiger Hardware mittels lediglich einer Software
- NI CompactRIO – für anspruchsvolle Steuer- und Regelanwendungen
- Die PXI-Plattform für automatisierte Testsysteme

Die Teilnahme am Praxisseminar ist kostenlos. Alle Teilnehmer erhalten zusätzlich ein umfassendes Handbuch mit detaillierten Informationen.

Anmeldemöglichkeiten, aktuelle Informationen, die ausführliche Agenda sowie alle Termine und Veranstaltungsorte finden Sie unter ni.com/german/seminartour.

Über National Instruments

Seit 1976 stellt National Instruments (www.ni.com) Ingenieuren und Wissenschaftlern Werkzeuge zur Verfügung, mit denen sie produktiver, innovativer und kreativer arbeiten können. Das Konzept des Graphical System Design gibt Anwendern eine Plattform mit integrierter Hard- und Software für die schnelle Entwicklung von Mess-, Steuer- und Regelsystemen an die Hand. Das langfristige Ziel des Unternehmens, die Zukunft der Gesellschaft mit seinen Technologien zu verbessern, unterstützt den Erfolg von Kunden, Angestellten, Zulieferern und Aktionären.

Kontakt für Kunden

Deutschland:

National Instruments Germany GmbH
Ganghoferstraße 70 b • 80339 München
Tel.: +49 89 7413130 • Fax: +49 89 7146035
info.germany@ni.com • ni.com/germany

Österreich:

National Instruments GesmbH
Plainbachstraße 12 • 5101 Salzburg-Bergheim
Tel.: +43 662 457990-0 • Fax: +43 662 457990-19
ni.austria@ni.com • ni.com/austria

Schweiz:

National Instruments Switzerland Corp. Austin,
Zweigniederlassung Ennetbaden
Sonnenbergstrasse 53 • 5408 Ennetbaden
Tel.: +41 56 2005151 • Fax: +41 56 2005155
ni.switzerland@ni.com • ni.com/switzerland